

**特長**

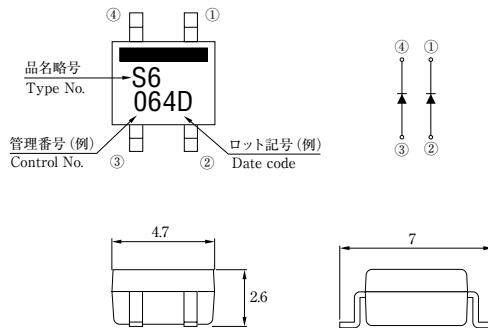
- SMD
- ツイン
- 耐湿性に優れ高信頼性

Feature

- SMD
- Twin-Di
- High-Reliability

■外観図 OUTLINE

Package : 1Z

Unit : mm
Weight : 0.13g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)**

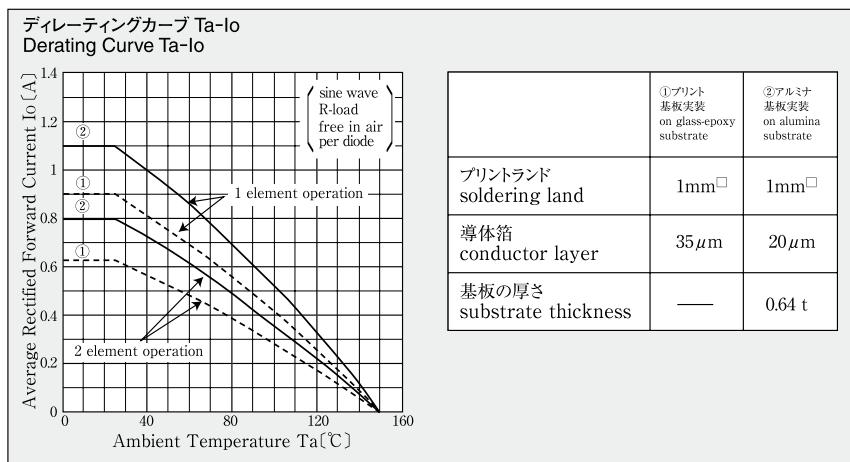
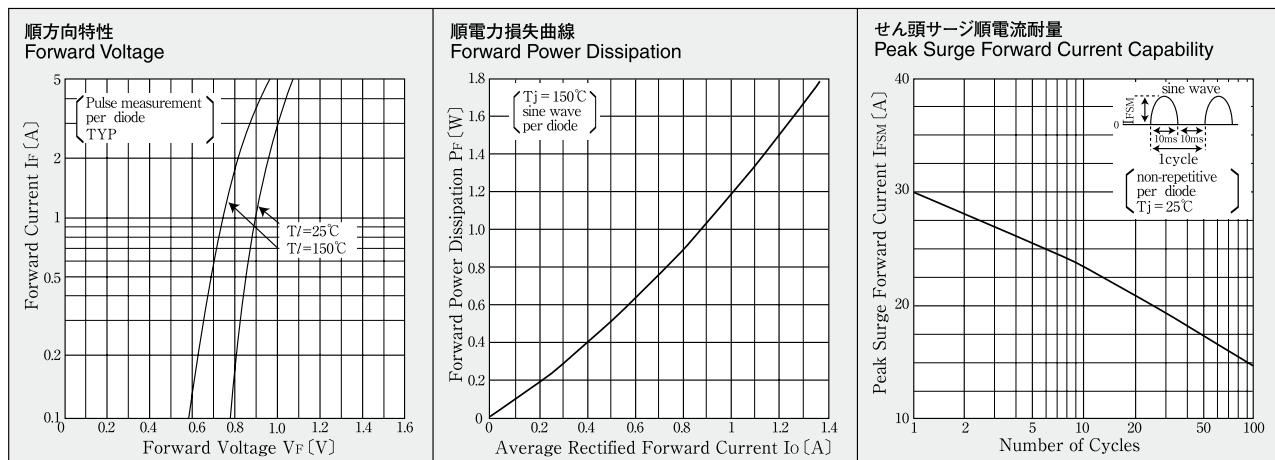
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZA20	S1ZA60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 25^\circ\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	1.1	A
				2回路通電 2 element operation	0.8 *	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	0.9	
				2回路通電 2 element operation	0.63 *	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波、非繰り返し 1 サイクルせん頭値。 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$			30 *	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=0.9A,	パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM,	パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θja	接合部・周囲間 Junction to Ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 93
				2回路通電 2 element operation	MAX 140 *
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 120
				2回路通電 2 element operation	MAX 186 *

* : 1 素子当たりの規格値 * : per diode

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is characteristic variation.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.